

# Einladung

## 3. XPS-Seminar

20. und 21. Juni 2012



in Zusammenarbeit mit der  
KNMF des Karlsruher Instituts  
für Technologie (KIT)

Thermo Fisher Scientific GmbH  
Im Steingrund 4-6  
63303 Dreieich

Bitte ausfüllen und faxen an Sales Administration  
+49 6103 408 1640 oder online unter:  
[www.thermoscientific.de/xpsseminar](http://www.thermoscientific.de/xpsseminar)

Ich melde mich an zum XPS-Seminar in Karlsruhe:

**Absender:**

Name: \_\_\_\_\_

Vorname: \_\_\_\_\_

Funktion: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Abteilung: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ, Ort: \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Telefax: \_\_\_\_\_

Unterschrift \_\_\_\_\_

**Ich melde mich verbindlich an:\***

**\*) Datenschutz:** Ihre Daten werden nur von Thermo Fisher Scientific GmbH, Im Steingrund 4-6, 63303 Dreieich sowie von Unternehmen der weltweiten Thermo Fisher Scientific Gruppe zu Werbezwecken genutzt. Dabei wird die Einhaltung von EU bzw. nationalen Datenschutzvorschriften gewährleistet. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Unternehmen außerhalb der Thermo Fisher Scientific Gruppe erfolgt nicht. Widerruf jederzeit durch Mitteilung auf [www.thermoscientific.com](http://www.thermoscientific.com) möglich.

Sollten Sie mit der Nutzung Ihrer o.g. Daten zu zukünftigen Werbezwecken nicht einverstanden sein, kreuzen Sie hier bitte  **NEIN** an.

Bitte ausfüllen und faxen an Sales Administration **+49 6103 408 1640**  
Anmeldung auch online unter: [www.thermoscientific.de/xpsseminar](http://www.thermoscientific.de/xpsseminar)

Seit Anfang 2009 kooperieren das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und Thermo Fisher Scientific zur Demonstration des neuartigen **Thermo Scientific K-Alpha Röntgen-Photoelektronenspektrometers (XPS)**.

Thermo Fisher Scientific und die Karlsruhe Nano Micro Facility (KNMF) des KIT veranstalten seitdem ein Seminar mit Schwerpunkt Röntgen-Photoelektronenspektroskopie (XPS).

Experten berichten aus ihren Arbeitsgebieten und Mitarbeiter von Thermo Fisher Scientific werden spezielle Applikationen und das neue Konzept des K-Alpha Instruments vorstellen. Ziel der Veranstaltung ist es, die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten eines modernen XPS-Gerätes in Forschung und Industrie aufzuzeigen.

In diesem Jahr wird zusätzlich die zu XPS komplementäre Flugzeit-Sekundärionen-Massenspektrometrie (ToF-SIMS) vorgestellt.

Das kostenfreie Seminar richtet sich sowohl an erfahrene Nutzer als auch an Neueinsteiger. Nach Absprache besteht die Möglichkeit, eigene Proben zu messen.

## Ansprechpartner:

### Termine

Dr. Ludwig Käselitz +49 171 7589019  
Dr. Beate Gade +49 171 7589018

### Anmeldungen & Hotelempfehlung

Frau Petzsche +49 6103 4081260

### KNMF, KIT

Dr. Michael Bruns michael.bruns@kit.edu

## Veranstaltungsort:

Karlsruher Institut für Technologie (KIT, Campus Nord)  
Hermann-von-Helmholtz-Platz 1  
76344 Eggenstein-Leopoldshafen

**Anfahrt:** <http://www.kit.edu/visit/directions.php>

**Begrüßung & Vorträge:** Bau 640, Raum 0-167

**Gerätedemonstrationen:** Bau 321, R 302

## Programm am 20. Juni

(Chair: B. Gade / M. Bruns)

10:00	<b>Welcome and Refreshments</b>
11:00	<b>Introduction</b> M. Bruns, KIT & B. Gade, Thermo
11:10	<b>Karlsruhe Nano Micro Facility (KNMF)</b> C. Kübel, KIT
11:20	<b>XPS: Basics and Recent Studies on Nano-scaled Thin Films and Polymer Modified Surfaces</b> M. Bruns, KIT
12:00	<b>Lunch Break</b>
13:00	<b>Modelling of the Spectral Background of Photoelectron Spectra with the Shirley and Improved Tougaard Methods</b> R. Hesse, Universität Leipzig
13:30	<b>XPS-Analyse in der angewandten Materialforschung</b> S. Dieckhoff, FhG-IFAM, Bremen
14:00	<b>Nutzung der Photoelektronenspektroskopie bei industriellen Fragestellungen</b> A. Schäfer, nanoAnalytics GmbH, Münster
14:30	<b>EDX und WDX als Komplementärmethoden zu XPS</b> B. Gade, Thermo Fisher Scientific, Dreieich
15:00	<b>Walk to the XPS Lab &amp; Coffee Break</b>
15:30	<b>K-Alpha Demos</b> T Nunney, R. White, Thermo Fisher Scientific M. Bruns & Surface Analysis Group, KIT
18:00	<b>End</b>

**Talks in German, PPT in English**

## Programm am 21. Juni

(Chair: M. Bruns / B. Gade)

9:00	<b>Surface Analysis from Thermo Fisher Scientific</b> R. White, Thermo Fisher Scientific, East Grinstead, UK
9:50	<b>K-Alpha and MAGCIS – depth profiling of organic and mixed materials</b> T. Nunney, Thermo Fisher Scientific, East Grinstead, UK
10:40	<b>Coffee Break</b>
11:10	<b>Application of XPS in Materials Science</b> J. Watts, University of Surrey, UK
12:00	<b>Lunch Break</b>
13:30	<b>Basics, Applications, and Latest Developments in Time-of-Flight Secondary Ion Mass Spectrometry (TOF-SIMS)</b> S. Kayser, ION-TOF GmbH, Germany
14:20	<b>Discussion and Closing Remarks</b>
14:45	<b>Walk to the XPS Lab</b>
15:00	<b>K-Alpha &amp; Alpha 110 Demos</b> T. Nunney, R. White, Thermo Fisher Scientific, East Grinstead, UK M. Bruns & Surface Analysis Group, KIT
18:00	<b>End</b>



**Talks in English**